
Difractometru de raze X de inalta rezolutie si intensitate ridicata a fasciculului, dedicat pentru analiza si cartografierea structurii cristaline, texturii si macro-tensiunilor în filme subtiri si monocristale masive.

I.D.: 21746741

Data publicarii	12.08.17	Coduri CPV	38530000 51430000 80510000
-----------------	----------	------------	----------------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.09.17 16:00	Pretul estimativ:	1.890.756,00 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	------------------

Descriere: Furnizarea, instalarea si punerea in functiune cu instruirea personalului utilizator a unui Difractometru de raze X de inalta rezolutie si intensitate ridicata a fasciculului, dedicat pentru analiza si cartografierea structurii cristaline, texturii si macro-tensiunilor în filme subtiri si monocristale masive.
